Provided by Xiamen University Institutional Repos

物理化学学报

Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35 (11), 1232–1240



[Article]

1232

doi: 10.3866/PKU.WHXB201901025

www.whxb.pku.edu.cn

Fabrication of a ZnSe/MoO₃/TiO₂ Composite Film Exhibiting Photocathodic Protection Effect

WANG Haipeng ¹, GUAN Zichao ¹, WANG Xia ¹, JIN Piao ¹, XU Hui ¹, CHEN Lifang ¹, SONG Guangling ^{2,*}, DU Ronggui ^{1,*}

¹ Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, P. R. China.

² Center for Marine Materials Corrosion and Protection, College of Materials, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, P. R. China.

Abstract: TiO₂ is a semiconductor material with excellent photoelectrochemical properties that can provide photocathodic protection for metals. However, TiO₂ can only absorb ultraviolet (UV) light at wavelengths of < 380 nm because of its wide band gap. In addition, photo-induced electron-hole pairs in the TiO₂ semiconductor easily recombine, which leads to a low photoelectric conversion efficiency. Another shortcoming is that pure TiO₂ semiconductors cannot sustain photocathodic protection in the dark, which may limit their practical applications to provide photocathodic protection. To address these



shortcomings, various modification methods have been established by preparing TiO₂ composite materials to improve their photoelectrochemical properties. In this study, a ZnSe- and MoO₃-modified TiO₂ nanotube composite film with charge storage ability was prepared to enhance its photocathodic protection effect on stainless steel. A TiO₂ nanotube array film was prepared on a Ti foil via anodic oxidation and then MoO3 and ZnSe particles were deposited onto the film by cyclic voltammetry and pulse electrodeposition, respectively, to afford a ZnSe/MoO₃/TiO₂ nanotube composite film having a cascade band structure. Scanning electron microscopy observations showed that the TiO2 film consisted of ordered nanotubes with an average inner diameter of approximately 100 nm and wall thickness of approximately 15 nm. This nanotube structure remained intact after MoO₃ and ZnSe particle deposition on the film. Energy dispersive spectroscopy, X-ray diffraction, and X-ray photoelectron spectroscopy analyses indicated that the prepared nanotube composite film was composed of ZnSe, MoO₃, and TiO₂. The UV-Vis absorption and photoluminescence spectra showed that the photoresponse of the composite film was extended to the visible light region and the photo-induced electron-hole pair recombination was reduced. Photoelectrochemical and electrochemical measurements indicated that the photocurrent intensity of the composite film in a 0.5 mol·L⁻¹ KOH solution was two-fold higher than that of the pure TiO₂ film. Under white light illumination, the ZnSe/MoO₃/TiO₂ composite film decreased the potential of the coupled 403 stainless steel (403SS) in a 0.5 mol·L⁻¹ NaCl solution by 470 mV (relative to the corrosion potential), demonstrating an effective photocathodic protection effect. It should be noted that the composite film exhibited a charge storage capability and could continuously provide cathodic protection for 22.5 h after illumination was stopped. In addition, electrochemical impedance spectroscopy results indicated that the composite film significantly decreased the charge transfer resistance of the coupled 403SS, highlighting the photocathodic protection effect on 430SS.

Key Words: Anodic oxidation; Electrochemical deposition; TiO₂ nanotube; Stainless steel; Photoelectrochemical property; Photocathodic protection

Received: January 9, 2019; Revised: February 25, 2019; Accepted: February 26, 2019; Published online: March 14, 2019. *Corresponding author. Emails: guangling.song@hotmail.com (S.G.); rgdu@xmu.edu.cn (D.R.). Tel.: +86-592-2189192 (S.G. & D.R.). The project was supported by the National Natural Science Foundation of China (21573182, 51731008, 51671163, 21621091, J1310024). 国家自然科学基金(21573182, 51731008, 51671163, 21621091, J1310024)资助项目 © Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica

ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的制备及其光生阴极保护效应

王海鹏¹,官自超¹,王霞¹,金飘¹,许慧¹,陈丽芳¹,宋光铃^{2,*},杜荣归^{1,*} 1厦门大学化学化工学院化学系, 福建 厦门 361005 2厦门大学材料学院,海洋材料腐蚀防护研究中心,福建 厦门 361005

摘要:针对TiO2半导体不能有效吸收可见光,光电转换效率较低等问题,可通过对TiO2半导体进行修饰和改性,制备TiO2 复合材料,提高其光电化学性能。因此,本工作以Ti表面制备的TiO2纳米管膜为基础,分别应用循环伏安电沉积法和脉 冲电沉积法在膜表面先后沉积MoO3和ZnSe颗粒,获得具有级联能带结构的ZnSe/MoO3/TiO2纳米管复合膜,并将其应用 于对403不锈钢(403SS)实施光生阴极保护。相较于纯TiO2纳米管膜,紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱和光致发光(PL)谱测试 表明,ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的吸收边红移,在可见光区具有良好的光吸收性能,光生载流子复合得到更有效抑制。光 电化学测试表明,白光照射下,处于0.5 mol·L⁻¹ KOH溶液中的ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的光电流密度达到了同条件下纯 TiO2膜的2倍,可使与之耦连的浸泡于0.5 mol·L⁻¹ NaCl溶液中的403SS电极电位下降470 mV,显示出良好的光生阴极保 护效应。复合膜还具有一定的储能特性,在光照后又转为暗态的22.5 h内仍对403SS具有一定阴极保护作用。

关键词:阳极氧化;电沉积;TiO2纳米管;不锈钢;光电化学性质;光生阴极保护 中图分类号: 0646

引言 1

通常,在太阳能能量转化和存储过程及其应 用中,光电转换性能优良、物理化学稳定性高、低 毒和廉价的半导体材料是不可或缺的。TiO2半导 体具备了以上优势,并在诸多研究领域有广泛的 应用,是一种非常合适的半导体材料1-4。1972年, Fujishima和Honda 5关于应用TiO2半导体进行光解 水制氢的研究报道引起了学术界的轰动。此后, TiO2半导体在光电化学领域的研究和应用大量涌 现。光生阴极保护就是在这样的研究背景下发展 起来的,是一种新兴的控制金属腐蚀的电化学保 护方法。1995年,Yuan等6首次提出了光生阴极保 护的概念。他们采用溶胶-凝胶法在Cu基底表面制 备了TiO2涂层,发现在紫外光照射时该涂层对Cu 具有光生阴极保护作用。与传统电化学阴极保护 相比,光生阴极保护技术不需要消耗阳极材料,也 不需要外加电源,在金属防腐方面的应用前景十 分诱人⁷⁻⁹。但是, TiO2是一种宽禁带半导体, 只能 吸收波长小于380 nm的紫外光¹⁰;此外,光激发产 生的电子-空穴对易复合,光电转换效率低11,使得 单纯的TiO2半导体应用于光生阴极保护受到限 制。至今已建立许多方法制备TiO2复合材料以解决 这些问题,如半导体复合12-14、非金属掺杂15-17以及 金属离子掺杂^{18,19}、量子点修饰¹³。此外,纯TiO2半 导体在光照转为暗态时不能维持光生阴极保护作 用,因此,构筑优良的储能型TiO2复合材料²⁰,对 提高其光生阴极保护性能有重要意义。

半导体复合是一种有效的半导体改性方法。这

是利用不同半导体之间的能级结构特性进行组合 形成复合材料,从而达到拓宽光吸收范围、抑制载 流子复合的作用²¹。相对于二元复合物,TiO₂半导 体的三元复合物往往能够更有效地改善性能,因 此受到了研究者的广泛关注^{13,22-24}。Kim及其同事²⁴ 对CdS/TiO₂/WO₃三元复合膜的电荷转移机理进行 了研究。他们发现由于三者之间形成的级联能带 结构产生了内建电势梯度,从而有效地促进了电 荷分离和转移。合理设计的三元纳米结构可以通 过跨越多个界面的电荷分离增加光生载流子数 量,有效提高光电化学性能。

正交型MoO₃ (α-MoO₃)因其高理论容量(1117 mAh·g⁻¹)、优良的化学稳定性以及对环境友好,在 锂离子电池、超级电容器以及太阳能电池等能量 存储和转换领域有着广泛的应用²⁵⁻²⁷。例如, Wang 等25合成了一种具有协同作用的MoO3/TiO2核壳纳 米线阵列电极应用于锂离子电池。纳米MoO3外壳 具有较高的比容量和良好的导电性,可快速传输 电荷。研究表明,这种优化的MoO3/TiO2电极(质量 比1:1)表现出较高的重量容量(670 mAh·g⁻¹)和优 异的循环性能(>200次)。Sun等²⁶利用循环伏安电 沉积法制备了用于超级电容器的α-MoO₃/TiO₂电 极。电化学测试表明,该电容器具有高电容(43.42 mF·cm⁻²), 甚至在3000次充放电循环之后依然保 持良好的电容行为。考虑到MoO3在储能领域中表 现出优异的特性,并且其导带和价带位置都低于 TiO₂,所以可用MoO₃作为三元复合膜中的电子存 储材料²⁸。ZnSe光电性能优越,在许多领域都有应

用^{29,30}。例如ThanhThuy等²⁹研究了ZnSe/TiO₂纳米 管膜对五氯苯酚的光降解作用,在AM1.5G的光照 条件下,2h后可以将99.0%的五氯苯酚除去。在同 样的条件下,单纯的TiO₂纳米管膜只能除去 64.0%。ZnSe的禁带宽度为2.7 eV,导带和价带位 置均高于TiO₂,并且光稳定性良好,非常适合作为 光敏剂³⁰。

因此,本工作以TiO2半导体为基础设计和制备具有级联能带结构的三元储能型复合膜,选用MoO3(有电子储存功能)和ZnSe(光敏剂)对TiO2进行改性。首先通过阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列膜,再依次使用循环伏安法和脉冲电沉积法于TiO2纳米管膜表面制备MoO3和ZnSe颗粒,获得具有级联能带结构的储能型ZnSe/MoO3/TiO2复合膜,并研究复合膜对403不锈钢(403SS)的光生阴极保护性能。

2 实验部分

2.1 ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的制备

本工作所用试剂均为分析纯,来自国药集团 化学试剂有限公司。用高纯去离水配制溶液。

将钛箔(纯度99.8%)裁剪成尺寸为15 mm × 10 mm × 0.1 mm的试样,实验前依次在丙酮、乙醇和 去离子水中超声清洗15 min。采用阳极氧化法在Ti 箔表面制备TiO2纳米管阵列膜³¹,即纯Ti箔作为阳 极,Pt片作为对电极,在质量分数为0.5%的HF溶 液中,于20 V电压下阳极氧化30 min。随后将样品 置于马弗炉中,从室温以5 °C·min⁻¹速率升至 450 °C后退火2 h,得到TiO2纳米管阵列膜。

采用循环伏安电沉积法在获得的TiO₂纳米管 膜表面沉积MoO₃颗粒²⁶。在传统的三电极体系中, 以TiO₂纳米管膜样品为工作电极,Pt片为对电极, 饱和甘汞电极(SCE)为参比电极。电解液为2 mmol·L⁻¹ (NH₄)₆Mo₇O₂₄和4 mmol·L⁻¹ Na₂MoO₄的 混合溶液,使用前先用1 mol·L⁻¹ H₂SO₄溶液调节混 合溶液的pH为4.0。循环伏安电沉积的电位范围是 -0.7 - 0.0 V (*vs* SCE),扫描速率为50 mV·s⁻¹,循 环沉积10次得到所需样品。然后将样品在马弗炉 中于400 °C下退火处理1 h (升温速率为 5 °C·min⁻¹),则得到MoO₃/TiO₂复合膜。

通过脉冲电沉积法在制得的MoO₃/TiO₂膜表 面制备ZnSe颗粒²⁹。沉积过程仍选用三电极体系, 工作电极为制备的MoO₃/TiO₂复合膜,对电极和参 比电极仍分别为Pt片和SCE。电解液为4 mmol·L⁻¹ SeO₂、20 mmol·L⁻¹ ZnCl₂和0.15 mol·L⁻¹ KCl的混 合溶液,以浓HCl溶液在实验前先把混合液pH调 节至1.5。电沉积的条件是:脉冲电位-2.0 V/0 V (vs SCE),对应于脉冲时间0.2 s/1.0 s,脉冲沉积循环 10次。沉积后得到的样品用大量去离子水冲洗并吹干,然后在N₂氛围中于200 °C下退火1 h,则得到 ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜。

2.2 样品表征

采用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM, Hitachi S4800)和透射电子显微镜(TEM, JEM-1400)观察样品形貌。以FE-SEM随机附带能量散射X射线能 谱仪(EDS)分析组成样品的元素,用X射线衍射仪(XRD, Rigaku Ultima IV)测试样品的晶体结构特征,并用X射线光电子能谱(XPS, PHI Quantum 2000)分析样品成分及其价态。通过紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)分光光度计(Varian, Cary 5000)和荧光光谱仪(Hitachi F-7000)表征样品的光吸收和荧光特性。

2.3 光电化学和光生阴极保护测试

暂态光电流测试采用三电极电解池,以制备的TiO2膜或其复合膜样品作为工作电极,SCE和Pt 丝分别为参比电极和对电极,0.5 mol·L⁻¹ KOH溶 液作为电解液。以北京卓立汉光150 W氙灯为光 源,使用荷兰Iviums公司制造的CompactStat.e便携 式电化学工作站测试样品的暂态光电流,测试在 开路电位条件下进行。

采用实验室搭建的光电化学测试系统观测所 制备的膜样品(作为光阳极)的光生阴极保护效应, 其装置如同我们以前的报道21。该系统包括光电化 学电解池(光电解池)和腐蚀测试电解池, 263 A恒 电位仪(Princeton Applied Research, USA)和150 W 氙灯光源(波长范围: 250-2000 nm)。以403SS作为 被保护金属,试样尺寸15 mm×10 mm×1 mm,制 作成有效面积为1 cm²的电极。腐蚀电解池中含有 0.5 mol·L⁻¹ NaCl溶液,以不锈钢试样、Pt片和SCE 分别作为工作电极、对电极和参比电极。作为光阳 极的膜样品处于光电解池中,并通过铜导线与腐 蚀测试电解池中的不锈钢试样连接。光电解池与 腐蚀测试电解池则通过盐桥(含饱和KCl的琼脂凝 胶)连接。通过测量与光阳极耦连的403SS在不同 条件下电极电位的变化,评价膜样品的光生阴极 保护效应。403SS的电化学阻抗谱(EIS)的测量同样 采用上述光电化学测试系统。403SS试样处于腐蚀 测试电解池中作为工作电极。测量的频率范围为 10⁵-10⁻² Hz, 扰动电压是10 mV。

3 结果与讨论

3.1 样品的表征



图 1 (a) TiO2 纳米管膜、(b) MoO3/TiO2 和(c)ZnSe/MoO3/TiO2 复合膜的 SEM 图, (d) ZnSe/MoO3/TiO2 复合膜 EDS 谱图 Fig. 1 SEM images of the (a) TiO2 nanotube film, (b) MoO3/TiO2 and (c) ZnSe/MoO3/TiO2 composite films; (d) EDS spectrum of the ZnSe/MoO3/TiO2 composite film.

图1a是阳极氧化法制备的TiO2膜的SEM图。可 以看出, TiO2膜由呈现阵列排布的纳米管组成。纳 米管的内管径和管壁厚度基本一致,分别约为100 和20nm,纳米管的表面比较平滑。图1b是通过循 环伏安沉积法在TiO₂纳米管表面沉积MoO₃后得 到的MoO₃/TiO₂复合膜的SEM形貌图。纳米膜保持 了原有TiO₂纳米管阵列的形貌特征,但因MoO₃颗 粒的沉积,复合膜的表面变得比较粗糙,管壁变 厚、管径变小。图1c是在MoO3/TiO2复合膜的基础 上,应用脉冲电沉积法沉积ZnSe后得到的 ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜SEM图。复合膜依然保持 阵列结构,但与图1b相比,可看出这种膜的表面更 加粗糙,纳米管表面有更多颗粒及其团聚物形成, 纳米管的管径不同程度变小,个别管口被纳米颗 粒团聚物所覆盖。图1d是ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜 的EDS谱图,从图中可以观察到,样品中存在Ti、 O、Mo、Zn和Se元素,初步确定膜样品中含有ZnSe、 MoO₃和TiO₂。通过先后两次不同的电沉积过程,可 以在 TiO₂ 纳米管膜的基础上合成得到 ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜。

为进一步确定所制备纳米膜的组成和结构,我 们对样品进行了XRD和XPS分析。图2为TiO₂纳米 管膜、MoO₃/TiO₂复合膜和ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜 的XRD谱图。可以看到,不同纳米膜的XRD谱图 中都有锐钛矿型TiO₂的谱峰,位于25.4°和48.1°的 两个峰对应着锐钛矿TiO₂的(101)和(200)晶面 (PDF #02-0387)。图2b和c谱图中位于23.3°和27.3° 处的两个峰分别是由α-MoO₃的(110)和(021)晶面 (PDF #85-2405)产生的²⁸,而图2c中29.3°的谱峰则 来自于闪锌矿ZnSe的(101)晶面(PDF #80-0008)³²。 XRD分析表明复合膜主要由锐钛矿TiO₂、α-MoO₃ 和闪锌矿ZnSe组成,通过两步电沉积,可使MoO₃ 和ZnSe颗粒在TiO₂纳米管表面形成。

图3分别展示了ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜中Ti 2p、Mo3d、Zn 2p和Se 3d的高分辨XPS谱图。

如图3a所示,位于458.9和464.7 eV处的两个峰 对应于Ti 2p_{3/2}和Ti 2p_{1/2},表明Ti⁴⁺存在于复合膜 中³³。对于Mo 3d,图3b中232.0和235.4 eV分别对 应于Mo 3d_{5/2}和Mo 3d_{3/2}的特征峰^{34,35}。图3c中,O 元素分别以晶格氧(530.3 eV,O-Ti)和吸附氧 (531.8 eV,O-H)存在于复合膜中³⁶。在图3d中,结 合能位于1024.4和1047.5 eV处的两个谱峰分别属 于Zn 2p_{3/2}和Zn 2p_{1/2}³⁷。从图3e显示XPS谱图可以 看出,复合膜中Se元素的结合能位于54.5 eV的谱





图 3 ZnSe/MoO₃/TiO₂ 复合膜中(a) Ti 2*p*, (b) Mo 3*d*, (c) O 1*s*, (d) Zn 2*p*和(e) Se 3*d* 的 XPS 谱图 Fig. 3 XPS spectra of the ZnSe/MoO₃/TiO₂ composite film: (a) Ti 2*p*, (b) Mo 3*d*, (c) O 1*s*, (d) Zn 2*p* and (e) Se 3*d*.

峰对应着Se 3d,与文献报道的数值几乎相同³⁷。 XPS测试再次说明复合膜中含有以上元素。

综合以上SEM、EDS、XRD和XPS的分析结 果,表明本工作已成功制备了ZnSe/MoO₃/TiO₂纳 米管复合膜。

3.2 光学性质

通过测试所制备的半导体膜在不同波长范围 对光的吸收强度,可评价其对光的吸收特性³⁸。图 4展示了不同纳米膜的紫外-可见(UV-Vis)吸收光 谱。如图4a所示,在波长为200-330 nm范围内,纯



图 4 (a) TiO2 纳米管膜, (b) MoO3/TiO2 和 (c) ZnSe/MoO3/TiO2 复合膜的紫外-可见吸收光谱 Fig. 4 UV-Vis absorption spectra of (a) TiO2 nanotube film, (b) MoO3/TiO2 and (c) ZnSe/MoO3/TiO2 composite films.

TiO₂纳米管膜具有高的光吸收强度。当波长大于 330 nm,光吸收强度陡降;当波长大于380 nm,TiO₂ 纳米管膜的光吸收强度处于低水平。上述结果说 明所制备的纯TiO₂纳米管膜主要是吸收波长小于 380 nm的紫外光,这与锐钛矿型TiO₂半导体(禁带 宽度为3.20 eV)的光吸收特性完全吻合。图4b和c 分别为MoO₃/TiO₂和ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的光 吸收谱,与纯TiO₂纳米管膜比较,在小于380 nm的 区域光吸收特性相似,但在可见光区复合膜的吸 光强度有很大的提高。此外,吸收带边也出现明显 的红移。特别是,ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜在可见光 区的吸收强度最高,说明沉积ZnSe和MoO₃后,TiO₂ 复合膜能够有效吸收可见光,其光学性质显著 改善。

图5是不同纳米膜样品的光致发光(PL)谱图。 PL谱可用于评价所制备的复合膜材料的光生载流 子分离性能。简单地说,半导体中载流子复合时会 产生光致发光,载流子复合率越高,光致发光的能 量越高,在PL谱图中谱峰强度也就越高^{39,40}。从图 中可以看出,不同纳米膜光致发光谱的变化趋势 相似,说明由TiO₂得到复合膜之后,并没有改变 TiO₂的发光特性,这是因为ZnSe和MoO₃在膜中的 含量低,发出相应的光十分微弱,不能改变复合膜 整体发光特性。但是,两种复合膜的谱峰强度都有 下降,表明改性后的TiO₂复合膜中光生载流子的



图 5 (a) TiO₂ 纳米管膜, (b) MoO₃/TiO₂ 和 (c) ZnSe/MoO₃/TiO₂ 复合膜的 PL 光谱 Fig. 5 PL spectra of the (a) TiO₂ nanotube film, (b) MoO₃/TiO₂ and (c) ZnSe/MoO₃/TiO₂ composite films.

复合率降低,ZnSe和MoO3的引入促进了复合膜中 电子-空穴对的分离。特别是ZnSe/MoO3/TiO2复合 膜的谱峰强度最低,说明其中载流子分离效率最 高。结合上述UV-Vis吸收光谱和PL谱的测量结果, 可以看出,相比TiO2或ZnSe/MoO3纳米膜, ZnSe/MoO3/TiO2复合膜具有更优良的光学性质,因 此,这种复合膜也可能具有最好的光电化学性能。

3.3 光电化学特性

暂态光电流响应是在间歇光照条件下半导体 样品产生的光电流变化特性。这种变化与半导体 中光生载流子的产生和分离,以及半导体所处的 电 解 质 溶 液 相 关⁴¹ 。 TiO₂ 、 MoO₃/TiO₂ 和 ZnSe/MoO₃/TiO₂纳米膜的暂态光电流响应曲线如 图6所示。随着白光光源的打开和关闭,不同纳米 膜表现出相似的变化特征,即当打开光源时,光电 流密度迅速上升,此后光电流密度在一个很小的



图 6 (a) TiO2 纳米管膜, (b) MoO3/TiO2 和 (c) ZnSe/MoO3/TiO2 复合膜的暂态光电流响应 Fig. 6 Transient photocurrent responses of the (a) TiO2 nanotube film, (b) MoO3/TiO2 and (c) ZnSe/MoO3/TiO2 composite films.

范围内波动,并且在每次受到光照时所达到的光 电流密度与各自的前一次数值基本一致。当光源 关闭时,光电流密度迅速下降至接近于零。这种重 复性的测量结果表明制备的纳米膜有良好的稳定 性。白光照射下,TiO₂、MoO₃/TiO₂和ZnSe/MoO₃/TiO₂ 复合膜的光电流密度分别为40、65和85 μA·cm⁻², ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的光电流密度大约是纯 TiO₂膜的2倍,说明ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的光电 转换性能最好,这与UV-Vis吸收光谱和PL谱的分 析表明复合膜具有最佳的光学性质密切相关。

3.4 光生阴极保护效应

图7展示了在不同条件下403SS电极电位随时 间的变化曲线。本工作以制备的TiO2纳米管膜或 者ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜作为光阳极,通过监测 与其耦连的403SS电极电位随时间的变化,评价光 阳极的光生阴极保护效应。图7a显示的是403SS的 自然腐蚀电位,即未与光阳极耦连时的开路电位, 大约为90 mV (vs SCE),可作为403SS与光阳极耦 连后电位发生变化的参考基准,进而评价所制备 膜的光生阴极保护效应。图7b和c表示分别耦连间 歇光照下的TiO₂纳米管膜和ZnSe/MoO₃/TiO₂复合 膜后,403SS电极电位的变化曲线。在第一次光照 开始之前,403SS的电极电位相对其腐蚀电位有所 下降,这是因为作为半导体光阳极的两种纳米膜 的电位均比403SS的自然腐蚀电位更负,当两者相 连接时,由于电偶效应,403SS的电位发生负移,即 电位降低²⁸。随着白光光源的开启和断开,403SS 的电极电位相应地降低和升高,而且变化非常迅 速。从图7b可看出,在光照TiO2纳米管膜后,与之 耦连的403SS的电极电位下降至约为-270 mV (vs



ZnSe/MoO₃/TiO₂ composite film under intermittent white light illumination.

SCE),说明在光照条件下TiO2纳米管膜能够为 403SS提供一定的光生阴极保护,这与已有的报道 结果相似³¹。但是,在光照后转为暗态下,403SS 电位迅速正移到光照前的电位,纳米膜光生阴极 保护效应消失。403SS与光照下的ZnSe/MoO3/TiO2 复合膜耦连时(图7c),其电极电位下降至约为-370 mV (vs SCE),显然,复合膜的阴极保护的效应明 显优于TiO₂纳米管膜。此外,在第二次光照时,耦 连的403SS的电极电位变化值与第一次光照的情 况相同,说明所制备的两种纳米膜光阳极都良好 的稳定性,这与暂态光电流的测量结果相对应。值 得注意的是, 第二次光照停止后长达22.5 h范围 内, 403SS电极电位仍保持在约为-240 mV (vs SCE),低于第一次光照前耦连的403SS的电极电 位,说明因光照复合膜产生阴极保护效应得到一 定程度的保持。可见,通过对TiO2纳米管膜进行改 性得到的ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜在光照前后对 403SS可提供更有效的阴极保护作用。在光照后转 为暗态时ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜表现出的阴极保 护效应,可能与其具有储能功能密切相关。

3.5 电化学阻抗谱

通过EIS测试,可以获得电极界面反应的电化 学信息,对于研究电极/溶液界面发生的电化学反 应过程有重要帮助⁴²。因此,我们通过测试不同条 件下403SS的阻抗谱,进一步研究所制备的纳米膜 对403SS的光生阴极保护效应。图8是403SS与受光 照的不同纳米膜耦连前后的Nyquist图。图9所示的 则是用于对EIS结果进行拟合的等效电路,其中*R*s 和*R*ct分别表示溶液电阻和界面电荷转移电阻,CPE 是代替电极界面电容的一种假想元件,称之为常 相角元件。CPE通常与导纳因子*Y*₀和可调因子*n*有 关。*n*取值有如下规律:当*n*=1时,是电容特性;当 *n*=0时,是电阻性质。对于一般的电极界面而言, *n*的取值在0.5–1之间^{43,44}。本工作主要通过对阻抗 谱拟合,求出不同条件下403SS的*R*ct值,评价制备 的纳米膜对403SS的光生阴极保护作用。

从图8可看出,403SS在不同条件下的Nyquist 图为一个半圆弧。图8a显示未耦连光阳极时403SS 阻抗谱圆弧半径最大,拟合的 R_{ct} 为675.82 k Ω ·cm²。 403SS分别与光照下的TiO₂纳米管膜(图8b)和 ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜(图8c)耦连后,阻抗谱中圆 弧半径依次变小,相应的 R_{ct} 值分别为42.56和18.51 k Ω ·cm²,说明与ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜耦连时 403SS电极的阻抗最小。也就是说,阻抗谱圆弧半 径越小, R_{ct} 数值越小。耦连纳米膜之后,403SS的 R_{ct} 数值有很明显的降低,说明两种纳米膜对403SS



图 8 403SS 在 0.5 mol L⁻¹ NaCl 溶液中不同条件下的 Nyquist 图

Fig. 8 Nyquist plots of 403SS in the 0.5 mol·L⁻¹ NaCl solution under different conditions.

(a) uncoupled, (b) coupled to the TiO_2 nanotube film and (c) coupled to

the ZnSe/MoO₃/TiO₂ composite film under intermittent white

light illumination.



图 9 403SS 在 0.5 mol·L⁻¹ NaCl 溶液中的等效电路图 Fig. 9 Equivalent circuit of 403SS in the 0.5 mol·L⁻¹ NaCl solution.

都有良好的光生阴极保护作用。这是因为纳米膜 在白光照射下产生的光生电子转移到403SS,加快 其表面的阴极反应,同时抑制阳极的溶解反应。耦 连ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜时403SS的R_{et}值最小,进 一步证明ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜对403SS具有更 有效的光电化学防腐蚀效应。

3.6 ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜电荷转移机理

白光照射下ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的电荷转 移机理可通过图10进行解释。从MoO₃到TiO₂再到 ZnSe,其导带的位置越来越负,价带位置的顺序 也是如此。因此,由这三种化合物组合形成了级联 能带结构的复合物。当复合膜受到白光激发时,一 方面,MoO₃、TiO₂和ZnSe价带中的电子被激发到 导带,而由于三者导带位置的差异,光生电子会往 电位更正的方向定向流动。ZnSe中的电子会一部 分转移到TiO₂的导带上,另一部转移到MoO₃。TiO₂ 的导带的部分光生电子通过外电路转移到403SS 表面,使其电极电位降低而受到阴极保护。另外还 有一部分TiO₂导带的电子则转移到MoO₃的导带 并且以还原能的形式储存起来^{28,45}。光生电子通过



Fig. 10 Schematic diagram of charge separation and transfer mechanism for the ZnSe/MoO₃/TiO₂ composite film under white light illumination.

了两个材料界面,能够更好地实现光生载流子的 分离。另一方面,MoO₃、TiO₂和ZnSe中价带上的 光生空穴会沿电位逐渐降低的方向迁移。这三种半 导体的价带位置也是向负方法逐级递减,因此,光 生空穴则沿着与电子转移相反的方向迁移到复合 膜的表面被溶液中的OH⁻等捕获而被消耗掉⁴⁶,这 个过程也进一步促进了光生电子-空穴对的分离。在 光照后又转为暗态时,MoO₃中储存的电子重新被 释放出来,并转移到403SS基体上,让403SS继续 处于阴极保护的状态。

4 结论

以制备的Ti表面TiO₂纳米管膜为基础,可通 过两次不同的电沉积方法在其表面制备MoO₃和 ZnSe颗粒,获得具有优良光电化学性能的 ZnSe/MoO₃/TiO₂纳米管复合膜。相较于纯TiO₂纳 米管膜,ZnSe/MoO₃/TiO₂复合膜的吸收边红移,在 可见光区具有良好的光吸收性能。特别是沉积 ZnSe和MoO₃后可更有效抑制复合膜中的光生载 流子的复合,光电化学性能得到大幅度提高。白光 照射下,复合膜在0.5 mol·L⁻¹ KOH溶液中的光电 流密度比单纯的TiO₂膜增加了1倍。白光照射下,复 合膜可使NaCl溶液中的403SS的电极电位和界面 电荷转移电阻显著下降,比TiO₂膜具有更有效的 光生阴极保护作用。特别是光照又转为暗态后,复 合膜对403SS仍有良好的光生阴极保护作用,这与 其具有储能作用相关。

References

 Chen, X. B.; Mao, S. S. Chem. Rev. 2007, 107, 2891. doi: 10.1021/cr0500535

- (2) Li, H. H.; Chen, R. F.; Ma, C.; Zhang, S. L.; An, Z. F.; Huang, W. *Acta Phys. -Chim. Sin.* 2011, 27, 1017. [李欢欢,陈润锋,马琮,张胜兰,安众福,黄维. 物理化学学报, 2011, 27, 1017.]
 doi: 10.3866/PKU.WHXB20110514
- (3) Zhang, J. F.; Wang, Y.; Shen, T. K.; Shu, X.; Cui, J. W.; Chen, Z.;
 Wu, Y. C. *Acta Phys. -Chim. Sin.* 2014, 30, 1535. [张剑芳, 王岩,
 沈天阔, 舒 霞, 崔接武, 陈忠, 吴玉程. 物理化学学报, 2014, 30, 1535.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201405221
- (4) Liu, C. B.; Wang, L. L.; Tang, Y. H.; Luo, S. L.; Liu, Y. T.; Zhang,
 S. Q.; Zeng, Y. X.; Xu, Y. Z. *Appl. Catal. B- Environ.* 2015, *164*, 1. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.08.046
- (5) Fujishima, A.; Honda, K. Natrue 1972, 238, 37.
 doi: 10.1038/238037a0
- (6) Yuan, J. N.; Tsujikawa, S. J. Electrochem. Soc. 1995, 142, 3444. doi: 10.1149/1.2050002
- (7) Ohko, Y.; Saitoh, S.; Tatsuma, T.; Fujishima, A. J. Electrochem. Soc.
 2001, 148, B24. doi: 10.1149/1.1339030
- (8) Park, H.; Kim, K. Y.; Choi, W. J. Phys. Chem. B 2002, 106, 4775. doi: 10.1021/jp025519r
- (9) Zhu, Y. F.; Zhang, J.; Zhang, Y. Y.; Ding, M.; Qi, H. Q.; Du, R. G.; Lin, C. J. *Acta Phys. -Chim. Sin.* 2012, *28*, 393. [朱燕峰,张娟, 张义永, 丁敏, 漆海清, 杜荣归, 林昌健. 物理化学学报, 2012, *28*, 393.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201112163
- (10) Zhou, H. L.; Qu, Y. Q.; Zeid, T.; Duan, X. F. *Energy Environ Sci.* **2012,** 5, 6732. doi: 10.1039/c2ee03447f
- Xu, H.; Ouyang, S. X.; Liu, L. Q.; Reunchan, P.; Umezawa, N.; Ye,
 J. H. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 12642. doi: 10.1039/c4ta00941j
- (12) Bai, H. W.; Liu, Z. Y.; Sun, D. D. J. Am. Ceram. Soc. 2013, 96, 942. doi: 10.1111/jace.12071
- (13) Zhang, J.; Du, R. G.; Lin, Z. Q.; Zhu, Y. F.; Guo, Y.; Qi, H. Q.; Xu,
 L.; Lin, C. J. *Electrochim. Acta* 2012, *83*, 59.
 doi: 10.1016/j.electacta.2012.07.120
- (14) Zou, X. J.; Li, X. Y.; Zhao, Q. D.; Chen, G. H. Chem. J. Chinese Univ. 2012, 33, 1046. [邹学军, 李新勇, 肇启东, 陈国华. 高等学 校化学学报, 2012, 33, 1046.] doi: 10.3969/j.issn.0251-0790.2012.05.033
- (15) Livraghi, S.; Paganini, M. C.; Giamello, E.; Selloni, A.; Valentin, C.
 D.; Pacchioni, G. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 15666.
 doi: 10.1021/ja064164c
- (16) Park, Y.; Kim, W.; Park, H.; Tachikawa, T.; Majima, T.; Choi, W. *Appl. Catal. B- Environ.* 2009, *91*, 355.
 doi: 10.1016/j.apcatb.2009.06.001
- (17) Zaleska, A.; Sobczak, J. W.; Grabowska, E.; Hupka, J. Appl. Catal.
 B- Environ. 2008, 78, 92. doi: 10.1016/j.apcatb.2007.09.005
- (18) Huang, F. Z.; Li, Q.; Thorogood, G. J.; Cheng, Y. B.; Caruso, R. A. J. Mater. Chem. 2012, 22, 17128. doi: 10.1039/c2jm32409a

- Momeni, M. M.; Ghayeb, Y. J. Electroanal. Chem. 2015, 751, 43.
 doi: 10.1016/j.jelechem.2015.05.035
- (20) Tatsuma, T.; Saitoh, S.; Ohko, Y.; Fujishima, A. Chem. Mater. 2001, 13, 2838. doi: 10.1021/cm010024k
- Hu, J.; Guan, Z. C.; Liang, Y.; Zhou, J. Z.; Liu, Q.; Wang, H. P.;
 Zhang, H.; Du, R. G. *Corros. Sci.* 2017, *125*, 59.
 doi: 10.1016/j.corsci.2017.06.003
- (22) Hou, Y.; Li, X. Y.; Zhao, Q. D.; Chen, G. H.; Raston, C. L. Environ. Sci. Technol. 2012, 46, 4042. doi: 10.1021/es204079d
- (23) Zhang, N.; Zhang, Y. H.; Pan, X. Y.; Yang, M. Q.; Xu, Y. J. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 18023. doi: 10.1021/jp303503c
- (24) Kim, H.; Kim, J.; Kim, W.; Choi, W. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 9797. doi: 10.1021/jp1122823
- (25) Wang, C.; Wu, L. X.; Wang, H.; Zuo, W. H.; Li, Y. Y.; Liu, J. P. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 3524. doi: 10.1002/adfm.201500634
- (26) Sun, S. P.; Liao, X. M.; Sun, Y.; Yin, G. F.; Yao, Y. D.; Huang, Z.
 B.; Pu, X. M. *RSC Adv.* 2017, *7*, 22983. doi: 10.1039/c7ra01164d
- (27) Ashok, A.; Vijayaraghavan, S. N.; Nair, S. V.; Shanmugam, M. RSC Adv. 2017, 7, 48853. doi: 10.1039/c7ra08988k
- (28) Liu, Q.; Hu, J.; Liang, Y.; Guan, Z. C.; Zhang, H.; Wang, H. P.;
 Du, R. G. J. Electrochem. Soc. 2016, 163, C539.
 doi: 10.1149/2.0481609jes
- (29) ThanhThuy, T. T.; Feng, H.; Cai, Q. Y. Chem. Eng. J. 2013, 223, 379. doi: 10.1016/j.cej.2013.03.025
- (30) Nguyen, V.; Li, W. L.; Pham, V.; Wang, L. J.; Sheng, P. T.; Cai, Q. Y.; Grimes, C. J. Colloid Interface Sci. 2016, 462, 389.
 doi: 10.1016/j.jcis.2015.10.005
- (31) Guan, Z. C.; Wang, H. P.; Wang, X.; Hu, J.; Du, R. G. Corros. Sci.
 2018, 136, 60. doi: 10.1016/j.corsci.2018.02.048
- (32) Zhu, L.; Peng, M. M.; Cho, K. Y.; Ye, S.; Sarkar, S.; Ullah, K.; Meng, Z. D.; Oh, W. C. *J. Korean Ceram. Soc.* 2013, *50*, 504. doi: 10.4191/kcers.2013.50.6.504

- (33) Zhai, C. Y.; Zhu, M. S.; Lu, Y. T.; Ren, F. F.; Wang, C. Q.; Du, Y. K.; Yang, P. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2014, *16*, 14800.
 doi: 10.1039/c4cp01401d
- (34) Lorenz, K.; Bauer, S.; Gutbrod, K.; Guggenbichler, J. P.; Schmuki,
 P.; Zollfrank, C. *Biointerphases* 2011, *6*, 16. doi: 10.1116/1.3566544
- (35) Guan, D. S.; Li, J. Y.; Gao, X. F.; Yuan, C. *RSC Adv.* 2014, *4*, 4055. doi: 10.1039/c3ra44849e
- (36) Antony, R. P.; Mathews, T.; Dash, S.; Tyagi, A. K.; Raj, B. *Mater*. *Chem. Phys.* **2012**, *132*, 957. doi: 10.1016/j.matchemphys.2011.12.041
- (37) He, L. C.; Zhang, Y. A.; Zhang, S. L.; Zhou, X. T.; Lin, Z. X.; Guo, T. L. *Mater. Technol.* 2018, *33*, 205. doi: 10.1080/10667857.2017.1396776
- (38) Rengaraj, S.; Li, X. Z. *Chemosphere* 2007, *66*, 930.
 doi: 10.1016/j.chemosphere.2006.06.007
- Jing, L. Q.; Qu, Y. C.; Wang, B. Q.; Li, S. D.; Jiang, B. J.; Yang, L.
 B.; Fu, W.; Fu, H. G.; Sun, J. Z. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2006, 90, 1773. doi: 10.1016/j.solmat.2005.11.007
- (40) Wu, Z.; Wang, Y. Y.; Sun, L.; Mao, Y. X.; Wang, M. Y.; Lin, C. J. *J. Mater. Chem. A* 2014, *2*, 8223. doi: 10.1039/c4ta00850b
- (41) Cummings, C. Y.; Marken, F.; Peter, L. M.; Tahir, A. A.;
 Wijayantha, K. G. U. *Chem. Commun.* 2012, *48*, 2027. doi: 10.1039/c2cc16382a
- (42) Park, S. M.; Yoo, J. S. Anal. Chem. 2003, 75, 455A. doi: 10.1021/ac0313973
- (43) Chen, W.; Du, R. G.; Ye, C. Q.; Zhu, Y. F.; Lin, C. J. Electrochim. Acta 2010, 55, 5677. doi: 10.1016/j.electacta.2010.05.003
- (44) Hamadou, L.; Kadri, A.; Benbrahim, N. *Appl. Surf. Sci.* 2005, 252, 1510. doi: 10.1016/j.apsusc.2005.02.135
- (45) Takahashi, Y.; Ngaotrakanwiwat, P.; Tatsuma, T. *Electrochim. Acta* **2004**, *49*, 2025. doi: 10.1016/j.electacta.2003.12.032
- (46) Chitrada, K. C.; Gakhar, R.; Chidambaram, D.; Aston, E.; Raja, K. S. J. Electrochem. Soc. 2016, 163, H546. doi: 10.1149/2.0721607jes